

Системный подход при проектировании, техническая
эксплуатация и обслуживание
электронных средств и автоматизированных систем

лекция 2

Билет 4

Безотказность



Вероятность безотказной работы

Случайной подразумевается величина, принимающая в результате опыта значение, которое предугадать невозможно.

Так как отказ – случайная величина, то и время появления отказа (время функционирования РЭС) t_{ϕ} – также случайная величина.

Все случайные величины делятся на **непрерывные** и **дискретные**.
Например, непрерывные - время безотказной работы,
дискретные – число отказов, число неисправных устройств и т.д.

Мерой безотказности является **вероятность безотказной работы** $P(t)$.

$P(t)$ - вероятность того, что время функционирования РЭС - t_0 будет больше некоторого заданного времени наработки t :

$$P(t) = P(t_{\phi} > t)$$

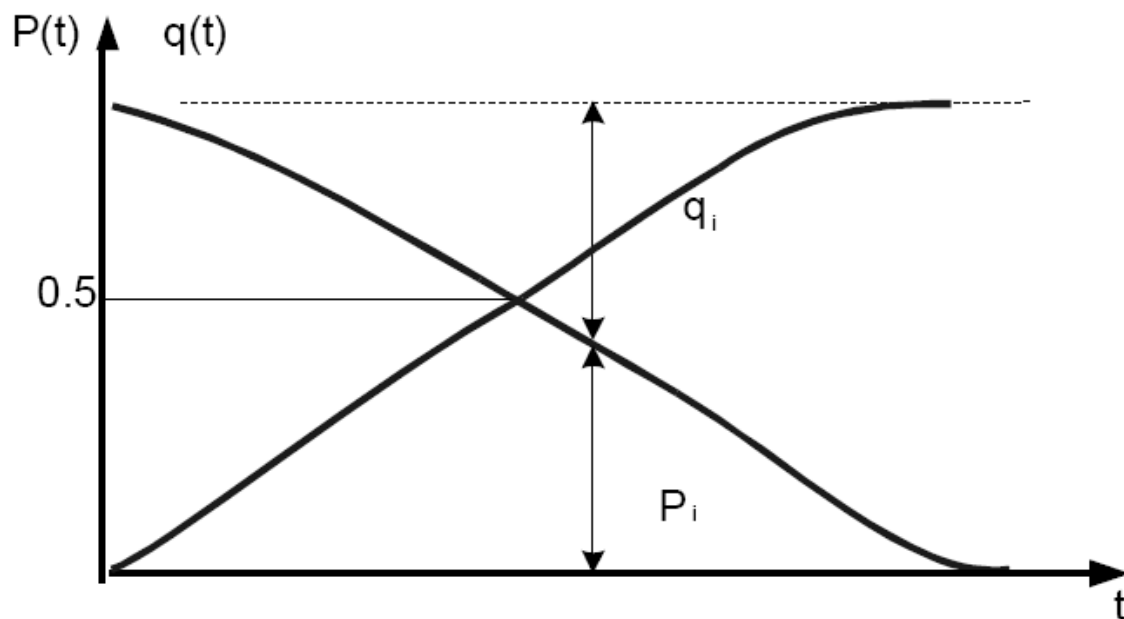
Полагая, что в момент включения РЭС работоспособно: $p(0)=1$, можно заметить, что $P(t)$ есть монотонно убывающая функция, причём $P(\infty)=0$ (в любой аппаратуре когда-нибудь произойдёт отказ).

$$P(0) = 1, P(\infty) = 0. \quad 1 > P(t_p) > 0.$$

Надёжность - вероятность отказа

Надёжность изделия удобнее характеризовать вероятностью отказа

$$q(t) = 1 - P(t) = P(t > t_0) = P(t_0 < t)$$



Алгебра вероятностей

Если вероятность события не меняется в зависимости от того, произошло другое событие или нет, то такие события называют **независимыми**.
Иначе - события считаются **зависимыми**.

События бывают **несовместные**, если они не могут появиться вместе.
События, у которых вероятность равна 1, называются **достоверными**.

Вероятность суммы n несовместных событий
(когда происходит любое из n событий)
равна сумме n вероятностей этих событий:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A_i);$$

Для системы, состоящей из ряда последовательно соединенных элементов, вероятность безотказной работы может быть представлена в виде **произведения вероятностей** безотказной работы всех элементов:

$$P_c(t) = P_1(t) P_2(t) \dots P_N(t) = \prod_{i=1}^N P_i(t).$$

Теорема полной вероятности:
где H_i - несовместные гипотезы.

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A | H_i)$$

Пример 2.1. На складе 100 приборов, из них 50 - исправные, 30 - не имеют отказов и 20 - отказавших. Найти вероятность того, что взятый наугад прибор будет работоспособен.

Пример 2.1. На складе 100 приборов, из них 50 - исправные, 30 - не имеют отказов и 20 - отказавших. Найти вероятность того, что взятый наугад прибор будет работоспособен.

Если принять: A - выбор работоспособного прибора, A_1 - исправного и A_2 - безотказных, то

$$P(A) = P(A_2) + P(A_1) = 0,5 + 0,3 = 0,8.$$

Пример 2.2. Каждое выпускаемое на заводе изделие может иметь дефект (вероятность дефекта $P_d=0,95$). Оно осматривается двумя контролерами, из которых первый обнаруживает дефект с вероятностью $P_1=0,8$, а второй — $P_2=0,9$. Найти вероятность того, что изделие будет забраковано.

Пример 2.2. Каждое выпускаемое на заводе изделие может иметь дефект (вероятность дефекта $P_D=0,95$). Оно осматривается двумя контролерами, из которых первый обнаруживает дефект с вероятностью $P_1=0,8$, а второй — $P_2=0,9$. Найти вероятность того, что изделие будет забраковано.

Если принять: A – дефект обнаружен, A_1 – первым и A_2 – вторым контролером, то

$$A = A_1A_2 + A_1\bar{A}_2 + \bar{A}_1A_2,$$

где \bar{A}_1, \bar{A}_2 - не обнаружение дефекта первым и вторым контролерами.

Тогда на основании теоремы полной вероятности получим

$$\begin{aligned} P(A) &= P_D[(A_1 \cdot A_2) + P(A_1 \cdot \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1 \cdot A_2)] = \\ &= 0,95[0,8 \cdot 0,9 + 0,8 \cdot 0,1 + 0,2 \cdot 0,9] = 0,931. \end{aligned}$$

Статистика безотказной работы

Вероятность $P(t)$ показывает, какая часть из группы одинаковых изделий будет работать **исправно** в течение заданного интервала времени t , поэтому практически величина $P(t)$ определяется статистическим путем по информации об отказах за выбранный промежуток времени t_i :

$$\overline{P_i} = \frac{(N - n_i)}{N}$$

где N – число изделий в начале испытаний;
 n_i – число изделий, отказавших за время t_i .

При числе изделий $N \geq 20$ статистическая вероятность P_i сходится к вероятности $P(t)$.

$$P(t) = P(t_\phi > t)$$

Пояснение:

Предположим, что работают, a изделий одного типа.

В течение времени t_p за ними ведется наблюдение и к концу интервала установлено, что b изделий работают исправно, а $(a-b)$ вышли из строя.

Тогда вероятность безотказной работы можно оценить следующим образом:

$$P(t_p) = b/a$$

Статистическая интенсивность отказов

Критерием, наиболее полно характеризующим надежность неремонтируемых объектов, является интенсивность отказов

Интенсивность отказов показывает, какая доля всех изделий или элементов данного типа в среднем выходит из строя за 1 час работы.

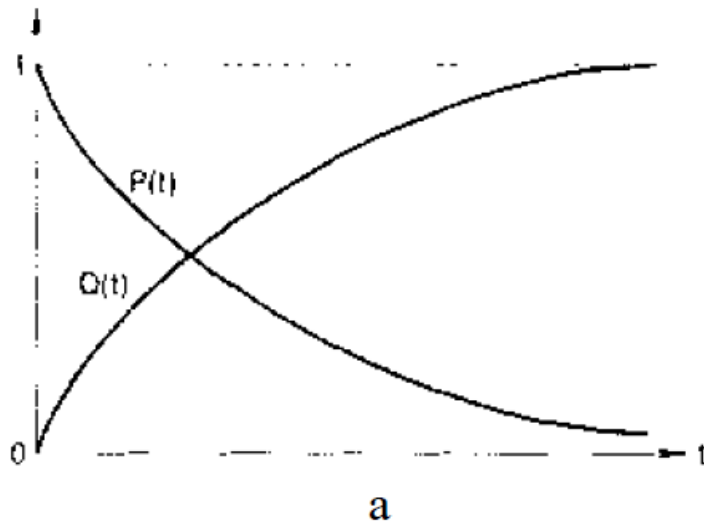
Из опытных данных она рассчитывается по формуле:

$$\lambda = \Delta n_i / (N_{CP} \Delta t_i),$$

где Δn_i – число отказов за промежуток времени Δt_i ; $N_{CP} = (N_i + N_{i+1})/2$ – среднее число работоспособных элементов; N_i – число элементов, работоспособных в начале рассматриваемого промежутка времени; N_{i+1} – число элементов, работоспособных в конце промежутка времени Δt_i .

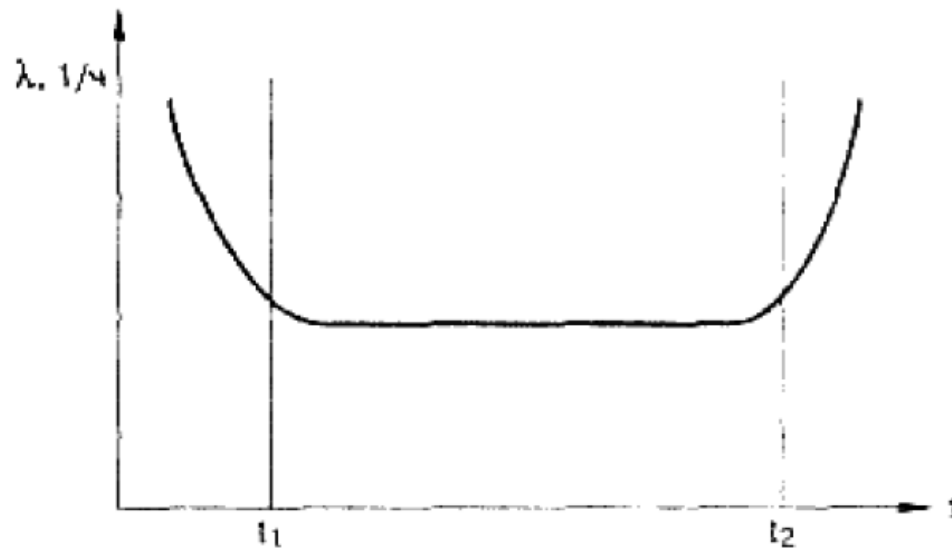
При определении надёжности аппаратуры имеют в виду то значение интенсивности отказов λ , которое имеет место в период нормальной работы.

Времена работы РЭС



Время от начала работы до момента t_1 называют **периодом приработки**.

В течение этого времени из строя выходят элементы, имеющие грубые внутренние дефекты, оставшиеся незамеченными при выходном контроле.



Время, когда происходят отдельные случайные отказы, называют **периодом нормальной работы**.

Время после момента t_2 , когда отказы непрерывно растут, называют **старением**.

I – приработка; *II* – нормальная эксплуатация; *III* – старение

Экспоненциальная интенсивность

Для большинства радиоэлектронных устройств вероятность безотказной работы может быть определена по формуле $P(t_p) = e^{-\lambda t}$, где λ – интенсивность отказов.

Например, если $\lambda=10^{-5}$, то это означает, что за 1 час работы из строя выйдет одна стотысячная доля элементов, соответственно за 1000 часов работы можно ожидать выхода из строя одной сотой доли всех элементов данного типа. Если в устройстве имеется 100 таких элементов, то в среднем за каждые 1000 часов из строя выходит один элемент.

Интенсивность отказов радиоэлектронной аппаратуры, состоящей из n различных элементов, определяют по формуле (потому что λ - степени):

$$\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

Ориентировочные значения интенсивности отказов для некоторых групп радиоэлементов

Электрорадиоэлементы	$\lambda_0 * 10^{-6}, 1/\text{ч}$
Микросхемы:	
цифровые биполярные и запоминающие устройства на цилиндрических магнитных доменах	0,1
цифровые МОП	0,3
аналоговые	0,8
Оптоэлектронные полупроводниковые приборы:	
диоды, излучающие лучи инфракрасного диапазона, фотодиоды	0,1
диоды, излучающие лучи видимого диапазона	0,3
оптопары транзисторные	0,5
оптопары диодные	0,2
оптопары тиристорные и резисторные	1,0
Резисторы:	
постоянные непроволочные пленочные	0,008
постоянные непроволочные объемные	0,005

Эти значения получены для случая, когда коэффициент нагрузки $K=1$ и температура $t=20\text{ }^\circ\text{C}$, их будем обозначать λ_0 .

Коэффициент нагрузки

Влияние внешних факторов на надежность радиоэлементов можно оценить с помощью **коэффициента нагрузки** K - отношение действительного значения воздействующего фактора к номинальному или максимально допустимому.

Например:

$$\text{— для транзисторов: } K = \frac{P_K}{P_{K_{\max}}},$$

где P_K — фактическая мощность, рассеиваемая на коллекторе; $P_{K_{\max}}$ — максимально допустимая мощность рассеивания на коллекторе;

$$\text{— для выпрямительных диодов: } K = \frac{I}{I_{\max}},$$

где I — фактический выпрямленный ток; I_{\max} — максимально допустимый выпрямленный ток;

$$\text{— для резисторов: } K = \frac{P}{P_H},$$

где P — фактическая мощность, рассеиваемая на ЭРЭ; P_H — номинальная мощность;

Коэффициент влияния

Влияние на надежность фактического значения коэффициента нагрузки и температуры учитывают при помощи коэффициента влияния, а $\lambda = a \lambda_0$.

Значения коэффициента влияния (а)

t °C	Значение а при K, равном				
	0,1	0,3	0,5	0,8	1,0
Постоянные пленочные углеродистые резисторы					
20	0,24	0,30	0,43	0,73	1,0
40	0,27	0,35	0,50	0,86	
60	0,34	0,45	0,64	1,2	
Постоянные проволочные резисторы					
20	0,13	0,20	0,30	0,60	1,0
40	0,15	0,22	0,35	0,75	1,27
60	0,17	0,27	0,45	1,04	
Непроволочные керметные и металлоокисные резисторы					
20	0,59	0,62	0,67	0,82	1,0
40	0,63	0,65	0,72	0,90	
60	0,70	0,74	0,82	1,06	
Переменные непроволочные композиционные пленочные резисторы					
20	0,15	0,24	0,36	0,66	1,0
40	0,20	0,32	0,50	0,94	

Средняя наработка до отказа

Величина интенсивности отказов также связана с другой характеристикой надежности - **средней наработкой до отказа** T_{cp} :

$$\bar{T}_{CP} = \sum_{i=1}^N t_i / N,$$

Допустим, какое-то количество РЭС одного и того же типа эксплуатируется заданное время.

При этом регистрируется суммарное количество часов t_{Σ} , которое проработали все изделия, и количество возникших отказов N . В этом случае средняя наработка до отказа:

$$T_{cp} \approx t_{\Sigma} / N$$

Естественно, что точность оценки средней наработки до отказа улучшается при увеличении количества проверяемых изделий. Чем больше T_{cp} , тем выше надежность РЭС.

Частота отказов

Под **частотой отказов** элементов понимают число отказов в единицу времени, отнесенное к первоначальному числу поставленных на испытание элементов.

$$\bar{f}_i = \frac{\Delta n_i}{N \cdot \Delta t_i}$$

где n_i – число отказов в интервале времени Δt_i ;
 N – число испытываемых изделий;
 Δt_i – время испытаний.

Функция частоты $f(t)$ характеризует скорость снижения надежности во времени и является **плотностью распределения** времени безотказной работы РЭС.

Интегральная частота отказов

Переведём в непрерывные величины:

$$\bar{P}_i = \frac{(N - n_i)}{N} = 1 - \frac{n_i}{N} \Rightarrow \frac{n_i}{N} = 1 - \bar{P}_i \Rightarrow \frac{n_i}{N \cdot \Delta t_i} = (1 - \bar{P}_i) / \Delta t_i$$

$$\Rightarrow f = \frac{dn}{N \cdot dt} = d(1 - P) / dt = -dP / dt = dQ / dt$$

$$f = -dP / dt = dQ / dt$$

$$P(t) = \int_0^t f(t) dt$$

$$Q(t) = \int_0^t f(t) dt$$

Интегральная средняя наработка

$$\bar{T}_{CP} = \sum_{i=1}^N t_i / N,$$

В сущности T_{cp} - это математическое ожидание времени работы до первого отказа.

$$M_X = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx \quad (0 \leq x < \infty).$$

$$T_{CP} = \int_0^{\infty} tf(t)dt = - \int_0^{\infty} tP^1(t)dt.$$

Интегрируя по частям, получим:

$$T_{CP} = -tP(t) \int_0^{\infty} + \int_0^{\infty} P(t) dt.$$

$$tP(t) \int_0^{\infty} = 0$$

так как при верхнем пределе $P(t)$ быстрее стремится к нулю, чем Δt - к бесконечности, поэтому:

$$T_{CP} = \int_0^{\infty} P(t)dt$$

а для экспоненциальной интенсивности:

$$\lambda = \frac{1}{T_{CP}}$$

Интегральная интенсивность

Интенсивность отказов $\lambda(t)$ связана с $f(t)$ и $P(t)$.

$$\lambda = \Delta n_i / (N_{CP} \Delta t_i), \text{ ч}^{-1}$$

$$\bar{\lambda}_i = \frac{\Delta n_i / N \Delta t_i}{N_{CP} \Delta t_i / N \Delta t_i} = \frac{\bar{f}_i}{(N - n_{cp}) / N} = \frac{\bar{f}_i}{\bar{P}_i}.$$

Переходя от дискретных понятий к непрерывным:

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{P(t)}.$$

Вероятность работ в интервале

λ

$$f = -dP / dt \Rightarrow \lambda(t) = -dP(t) / dtP(t),$$

$$\lambda(t) dt = -dP(t) / P(t).$$

$$P(t) = \exp\left[-\int_0^t \lambda(t) dt\right] + C.$$

$t = 0$ и $P(0) = 1$, следовательно, $C = 0$.

На практике часто представляет интерес вероятность безотказной работы РЭА на интервале (t_1, t_2) . В этом случае говорят об условной вероятности безотказной работы в момент времени t_2 , при условии, что в момент времени t_1 РЭС была работоспособна.

$$P(t_2, t_1) = \exp\left[-\int_{t_1}^{t_2} \lambda(t) dt\right].$$

Пример 2.2. В результате наблюдения за $N = 45$ неремонтируемы-ми объектами РЭА получены данные до первого отказа всех 45 образцов (табл. 2.3.). Требуется определить вероятность безотказной работы, интенсивность отказов, построить графики этих функций, а также найти среднюю наработку до первого отказа \bar{T}_{cp} .

Таблица 2.3

$\Delta t_i, ч$	Δn_i	$\Delta t_i, ч$	Δn_i	$\Delta t_i, ч$	Δn_i
0 - 5	1	30 - 35	4	60 - 65	3
5 - 10	5	35 - 40	3	65 - 70	3
10 - 15	8	40 - 45	0	70 - 75	3
15 - 20	2	45 - 50	1	75 - 80	1
20 - 25	5	50 - 55	0	—	—
25 - 30	6	55 - 60	0	—	—

Решение.

$$1. \bar{P}(t) = (N - \Delta n) / N; \quad \bar{\lambda}(t) = \Delta n / N_{CP} \Delta t$$

Рассчитанные по этим формулам данные сведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Δt_i ч	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
$\bar{P}(t)$	0,98	0,87	0,69	0,64	0,53	0,4	0,31	0,25
$\bar{\lambda}(t) 10^{-3}$ ч	4,5	2,41	45,7	13,3	37,7	57,1	50	48
Δt_i ч	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60-65	65-70	70-75	75 - 80
$\bar{P}(t)$	0,25	0,22	0,22	0,22	0,16	0,09	0,02	0
$\bar{\lambda}(t) 10^{-3}$ ч	0	19	0	0	70,8	109	240	1200

Графики $P(t)$ и $\lambda(t)$ приведены соответственно на рис. 2.7 и 2.8.

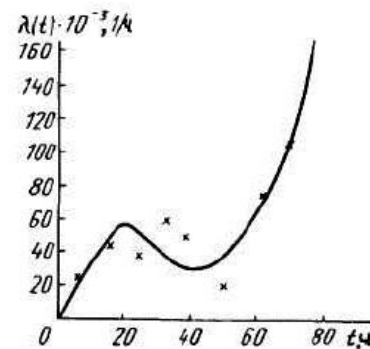
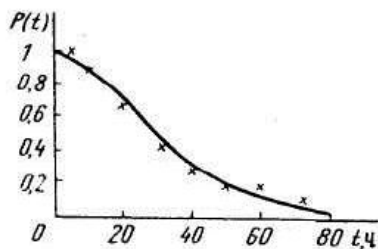


Рис. 2.7. Зависимость вероятности отказов от времени
Рис. 2.8. Зависимость интенсивности безотказной работы от времени

2. Средняя наработка до первого отказа:

$$\bar{T}_{CP} = \left(\sum_{i=1}^m \Delta n_i t_{CPi} \right) / N = \frac{1 \cdot 2,5 + 5 \cdot 7,5 + 8 \cdot 12,5 + \dots + 1 \cdot 77,5}{45} = 31,7 \text{ ч.}$$

Пример 2.1. Испытывается $N = 500$ изделий. За время $t = 2000$ ч отказало $n = 200$ изделий. За последующие $\Delta t_i = 100$ ч отказало еще $\Delta n_i = 100$ изделий. Определить $\bar{P}(2000)$, $\bar{P}(2100)$, $\bar{f}(2050)$ и $\bar{\lambda}(2050)$.

Пример 2.1. Испытывается $N = 500$ изделий. За время $t = 2000$ ч отказало $n = 200$ изделий. За последующие $\Delta t_i = 100$ ч отказало еще $\Delta n_i = 100$ изделий. Определить $\bar{P}(2000)$, $\bar{P}(2100)$, $\bar{f}(2050)$ и $\bar{\lambda}(2050)$.

Решение.

$$1. \bar{P} = \frac{N - n(2000)}{N} = \frac{500 - 200}{500} = 0,6; \quad \bar{P}(2100) = \frac{500 - 300}{500} = 0,4$$

$$2. \bar{f}(2050) = \frac{\Delta n_i}{N \Delta t_i} = \frac{100}{500 \cdot 100} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ ч}^{-1},$$

$$\bar{\lambda}(2050) = \frac{\Delta n_i}{N_{CP} \Delta t_i} = \frac{100}{(300 + 200) / 2 \cdot 100} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ ч}^{-1}.$$

3. Интенсивность отказа можно определить и по формуле (2.9):

$$\bar{\lambda}(2050) = \bar{f}_i / \bar{P}_i; \quad \bar{P}(2050) = \frac{500 - 250}{500} = 0,5.$$

Тогда
$$\bar{\lambda}(2050) = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{0,5} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ ч}^{-1}.$$

Билет 5

Теория массового обслуживания



Массовое обслуживание

Массовым обслуживанием (МО) называется система, состоящая из определённого числа обслуживающих единиц, называемых **каналами обслуживания**.

Такие системы могут быть одноканальными и многоканальными.

Основные характеристики системы МО:

- поток событий-отказов;
- число каналов обслуживания;
- быстродействие каждого канала.

Поток событий называется **простейшим**, если он обладает свойствами:

- 1) ординарности** (вероятность одновременного появления 2-х событий практически невозможна)
- 2) стационарности** (вероятность попадания того или иного события на участок времени от момента t до $t + dt$ не зависит от t , а зависит только от длины участка dt)
- 3) отсутствием последействия** (для двух отрезков времени число событий, попадающих в один из них, не зависит от числа событий, попадающих в другой).

Заявка на ремонт

Одной из важных характеристик системы МО является **среднее время обслуживания одной заявки T_{OB}** , которое на практике обычно имеет экспоненциальное распределение:

$$f(t) = \nu_{OB} \cdot e^{-\nu_{OB}t}; \quad \nu_{OB} = \frac{1}{T_{OB}}$$

$f(t)$ – плотность распределения функции распределения – универсальной характеристики распределения вида $F(x) = P(X < x)$, где $X < x$ – вероятность события, X – некоторая текущая переменная.

Системы МО делятся на **системы с отказами** и **системы с ожиданием**.

В первых системах – заявка, поступившая в момент, когда все каналы обслуживания заняты, получает отказ;

во вторых системах – заявка становится в очередь и ожидает, пока не освободится какой-либо канал.

Безотказность неремонтируемых и ремонтируемых изделий

Для неремонтируемых - показателями безотказности являются:

- вероятность безотказной работы $P(t)$;
- частота отказов $f(t)$;
- интенсивность отказов $\lambda(t)$;
- средняя наработка до первого отказа T_{CP} .

Для ремонтируемых характерно чередование исправного состояния и ремонта после отказа.

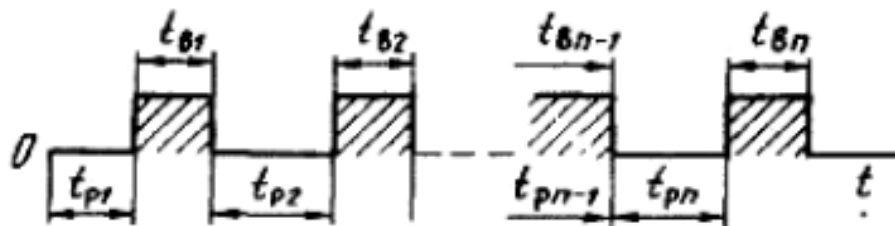
Появление отказов в каждом из N изделий рассматривается как поток требований для ремонта.

Поэтому показатели безотказности следующие:

- вероятность безотказной работы $P(t)$;
- параметр потока отказов $\omega(t)$;
- средняя наработка на отказ $\overline{T_o}$.

Время восстановления

Для ремонтируемых объектов характерно чередование исправного состояния и ремонта после отказа (появление отказов в каждом из N объектов можно рассматривать как поток требований для ремонта):



Такие РЭС характеризуют **средним временем восстановления $T_{\text{в}}$** .

Допустим, какое-то количество изделий одного и того же типа эксплуатируется заданное время.

При этом регистрируется суммарное количество часов $t_{\text{в}}$, затраченное на отыскание и устранение каждой неисправности, и количество возникших отказов N .

Тогда **среднее время восстановления $T_{\text{в}} \approx t_{\text{в}} / N$** .

Следует иметь в виду, что время, затраченное на отыскание и устранение конкретной неисправности, может быть больше или меньше $T_{\text{в}}$.

Параметр потока отказов

Параметр потока отказов - среднее число отказов за время рассматриваемого потока:

$$\bar{\omega} = \Delta n_i / (N \Delta t).$$

При этом число элементов в процессе опыта остается неизменным (отказавшие элементы заменяются новыми).

В сложном объекте (устройстве) результирующий поток отказов равен сумме потоков отказов отдельных устройств:

$$\omega_N = \sum_{i=1}^N \omega_i.$$

$$\omega(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(\Delta t)}{\Delta t}$$

$$P(t_1, t_2) = \exp \left[- \int_{t_1}^{t_2} \omega(t) dt \right]$$

Наработка на отказ

Для ремонтируемых объектов удобным для практики критерием надежности является среднее число часов работы между двумя соседними отказами, обычно называемое **наработкой на отказ** T_0 .

Если РЭС определенного типа проработала суммарное время t_Σ и имела при этом n отказов в работе, то наработка на отказ равна:

$$\bar{T}_0 = t_\Sigma / n.$$

Если же испытаниям подвергаются N однотипных объектов, то необходимо просуммировать время исправной работы по всем объектам и разделить его на общее число отказов:

$$\bar{T}_0 = \sum_{i=1}^N t_i / \sum_{i=1}^N n_i.$$

Для простейшего потока параметр потока отказов: $\bar{\omega} = 1/\bar{T}_0$

Ремонтопригодность

Процесс ремонта, заключающийся в обнаружении и устранении отказа, является случайным. В качестве случайной величины берется среднее время ремонта, которое складывается из времени, затрачиваемого на обнаружение отказа, поиск причин его возникновения и устранение последствий отказа.

Для **количественной оценки ремонтпригодности** применяется два показателя:

- средняя продолжительность текущего ремонта $T_{тр}$
- средняя продолжительность технического обслуживания $T_{то}$

Средняя продолжительность текущего ремонта есть математическое ожидание времени восстановления работоспособности:

$$\bar{T}_{TP} = (\sum_{i=1}^n T_{Pi}) / n.$$

$$T_{T.P} = \int_0^{\infty} T_{Pi} f(t_p) dt,$$

где T_{Pi} – время ремонта i -го объекта; $f(t_p)$ – плотность распределения случайной величины времени ремонта.

Интенсивность ремонта

Величина, обратная средней продолжительности текущего ремонта , называется **интенсивностью ремонта** и характеризует количеством ремонтов, произведенных в единицу времени:

$$\mu_p = 1/\bar{T}_{т.р}$$

Пример 2.3. При эксплуатации радиоэлектронного устройства было зарегистрировано $n = 20$ отказов, из них отказало: полупроводниковых приборов (ПП) – 6, резисторов и конденсаторов (Р и К) – 8, трансформаторов и дросселей (Т и Д) – 4, интегральных микросхем (ИС) – 2. На ремонт после выхода из строя ПП затрачивалось 15 мин, для Р и К – 10 мин, для Т и Д – 20 мин, для ИС – 25 мин. Найти среднее время ремонта.

Пример 2.3. При эксплуатации радиоэлектронного устройства было зарегистрировано $n = 20$ отказов, из них отказало: полупроводниковых приборов (ПП) – 6, резисторов и конденсаторов (Р и К) – 8, трансформаторов и дросселей (Т и Д) – 4, интегральных микросхем (ИС) – 2. На ремонт после выхода из строя ПП затрачивалось 15 мин, для Р и К – 10 мин, для Т и Д – 20 мин, для ИС – 25 мин. Найти среднее время ремонта.

Решение.

1. Находим вес отказов по группе элементов $m_i = n_i / n$.

$$m_1 = 6/20 = 0,3; m_2 = 8/20 = 0,4; m_3 = 4/20 = 0,2; m_4 = 2/20 = 0,1.$$

$$2. \bar{T}_{T.P} = \sum_{i=1}^4 t_{pi} m_i = 15 \cdot 0,3 + 10 \cdot 0,4 + 20 \cdot 0,2 + 25 \cdot 0,1 = 15 \text{ мин.}$$

Пример 2.3. Имеется простейшая 2-х канальная система МО с очередью. Интенсивность потока заявок $\lambda=3$ заявки в час. Среднее время обслуживания одной заявки $\bar{T}_{OB} = 0,5ч$. Найти вероятности состояний P_0, P_1, P_2 , вероятность наличия очереди $P_{Oч}$, среднюю длину очереди $M_{Oч}$ и среднее время пребывания заявки в очереди $t_{Oч}$.

Имеем число заявок $\alpha_3 = \lambda \bar{T}_{об} = 3 \cdot 0,5 = 1,5$. При этом число каналов $n=2$, т.к. $\alpha_3 < n$, то режим установившийся. Из [9] для расчета вероятностей состояния системы при $\alpha_3 < n$ воспользуемся формулой:

$$P_K = \frac{\alpha_3^k}{K!} / \left(\sum_{k=0}^n \frac{\alpha_3^k}{K!} + \frac{\alpha_3^{n+1}}{n!(n-\alpha_3)} \right), \quad (2.3)$$

где K – число состояний системы ($0 \leq k \leq n$).

Подставляя в формулу (2.3) численные значения, получим:

$$P_0 = 1 / 7 = 0,142,$$

$$P_1 = 1,5 / 7 = 0,214,$$

$$P_2 = 1,125 / 7 = 0,16.$$

Тогда вероятность наличия очереди:

$$P_{оч} = 1 - (P_0 + P_1 + P_2) = 1 - (0,142 + 0,214 + 0,16) = 0,484.$$

Средняя длина очереди, т.е. среднее число заявок, находящихся в очереди:

$$M_{оч} = \frac{\alpha_3^{n+1}}{n \cdot n!(1 - \alpha_3 / n^2)} / \sum_{k=0}^n \frac{\alpha_3^k}{K!} + \frac{\alpha_3^{n+1}}{n!(n-\alpha_3)}, \quad (2.4)$$

т.е.

$$M_{оч} = \frac{1,5^3}{2 - 1 \cdot 2(1 - 1,5/2)^2} / \sum_{K=0}^2 \frac{1,5^k}{K!} + \frac{1,5^3}{1 \cdot 2 \cdot 0,5} = \frac{13,5}{7} = 1,92$$

Среднее время пребывания $t_{оч} = M_{оч} / \lambda = 1,92 / 3 = 0,64$.

Количественные параметры надёжности

Итак для *количественного* выражения надёжности, готовности и экономичности используются эксплуатационно-технические показатели:

1) показатели безотказности:

а) для неремонтируемых изделий:

- вероятность безотказной работы $P(t)$,
- частота отказов $f(t)$,
- средняя наработка на отказ T_{CP} ;

б) для ремонтируемых изделий:

- вероятность безотказной работы $P(t)$,
- параметр потока отказов $\omega(t)$,
- средняя наработка на отказ T_o ;

2) показатели ремонтпригодности:

- средняя продолжительность текущего ремонта T_p ;
- средняя продолжительность техобслуживания $T_{ТО}$;

3) показатели долговечности:

а) для неремонтируемых изделий:

- средний срок службы $T_{СЛ}$;
- средний срок службы до списания $T_{СП}$;
- гамма - процентный срок службы $T_{слγ}$;
- средний ресурс $R_{СР}$;
- назначенный ресурс R_H ;
- гамма – процентный ресурс $R_γ$;

б) для ремонтируемых изделий:

- средний срок службы $T_{СЛ}$;
- средний срок службы до списания $T_{СП}$;
- гамма - процентный срок службы $T_{слγ}$;
- средний срок службы до капитального ремонта (среднего ремонта) $T_{СЛК}$ ($T_{СЛср}$) ;
- средний срок службы между капитальными (средними) ремонтами $T_{СЛмк}$, ($T_{СЛмср}$) ;
- средний ресурс $R_{СР}$;
- назначенный ресурс R_H ;
- гамма – процентный ресурс $R_γ$;
- средний ресурс до капитального (среднего) ремонта R_K ($R_{СР}$) ;
- средний ресурс между капитальными (средними) ремонтами $R_{мк}$, $R_{МСР}$,
- средний ресурс до списания $R_{СП}$;

4) показатели сохраняемости:

- средний срок сохраняемости T_C ,
- гамма – процентный срок сохраняемости $T_{C\gamma}$;

5) показатели готовности:

- коэффициент готовности K_G ,
- коэффициент оперативной готовности K_{OG} ,
- коэффициент технического использования $K_{ТИ}$;

6) эксплуатационно-экономические показатели:

- средняя трудоемкость текущего ремонта $S_{ТР}$,
- средняя трудоемкость ТО $S_{ТО}$,
- коэффициент эффективности профилактики $K_{ЭФП}$,
- коэффициент стоимости эксплуатации $K_{СТЭ}$.

По домам тарам-пам-пам!

k